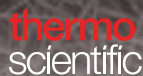


卓上走査型電子顕微鏡

Phenom Pharos

アメリカ サーモフィッシャーサイエンティフィック社製



世界初

卓上FE-SEMによる
走査透過電子顕微鏡観察



STEMホルダ
(オプション)

仕様

電子銃	: FE 電子銃
倍率	: 最大2,000,000倍
光学ナビゲーション	: カラー、27 ~ 160倍
反射電子検出器	: 標準搭載
二次電子検出器	: オプション
元素分析機能	: オプション

Resolution

フロアモデルに迫る高分解能を卓上 SEM で実現

さらに
「見る」

FE電子銃搭載
30秒で、分解能<2 nm

もっと
「操る」

誰でも簡単、スピーディに
高分解能観察

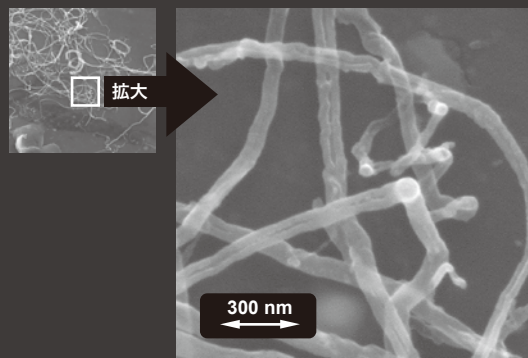
もっと
「測る」

「観察 + α !」



FE 電子銃でさらに美しく

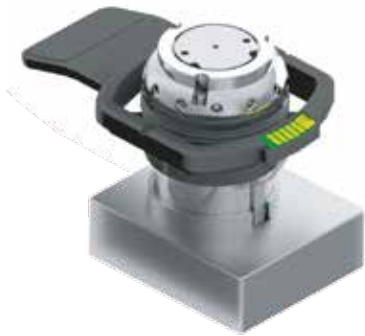
Carbon nanotube (カーボンナノチューブ) の観察例



ナノ～サブミクロンレベルの解析を実現

ファイバーメトリックソフトウェアによる銀ナノロッドの解析例



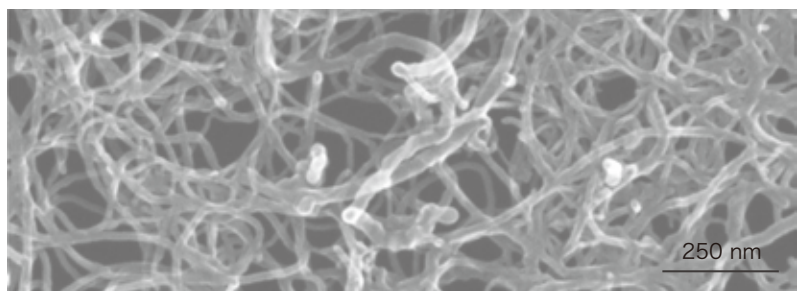
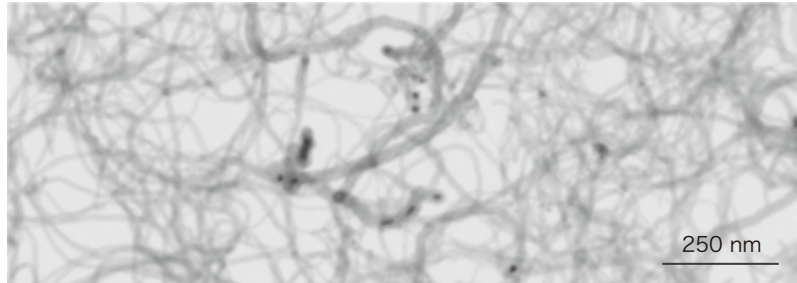


電界放出型電子銃（FEG）を搭載した Phenom Pharos卓上FE-SEM専用のSTEMホルダで、世界初の卓上による走査透過電子顕微鏡観察を可能にします。

低電圧で高コントラストを実現し、微細構造や形態の高分解能観察が可能です。様々な材料に対応し、広範囲を低倍率から高倍率に変えて観察を行うことができるため、サンプルのスクリーニングや結果の取得を迅速に行うことが可能です。

カーボンナノチューブの観察

STEMではSEMとは異なるコントラストが得られるため、2つの技術を使用することで相互補完的な情報収集が可能です。STEM像では、SED像では隠れていたこうした細部の情報を観察することが可能です。



カーボンナノチューブのSTEM像（上）とSED像（下）。STEM像では粒子の存在が確認できます。

ジャスコインタナショナル株式会社

• Web: www.jascoint.co.jp • E-mail: sales2@jascoint.co.jp

東京サービスセンター

〒192-0046 東京都八王子市明神町1-11-10

TEL: 042-643-3201(代) FAX: 042-660-8046

大阪サービスセンター

〒540-0028 大阪府大阪市中央区常盤町2-2-10 ブランクレール谷町205

TEL: 06-6940-0351(代) FAX: 06-6940-0352